# 電子システムインテグレーションの研究

大阪大学・工・生産科学専攻 <u>藤本公三</u>、金 鍾珉、安田清和 大阪大学・先端科学技術共同研究センター 岩田剛治、佐藤了平

# 1. はじめに

日本のエレクトロニクス産業は、この20年間、高機能化、 高信頼化、小型化、低コスト化の技術開発に支えられ、新た な電子デバイス・部品を組み込んだ電子システム創成の下、 日本の高度成長を牽引してきた。現在、エレクトロニクス産 業は経済、経営、雇用環境、科学技術などのグローバル化に 伴って、世界の産業を牽引する観点で、より高いグローバル オプティマイゼーションが求められている。また,このよう なグローバル化してきたエレクトロニクス産業において,日 本が世界をリードして行くには,ものづくりにおける創造的 付加価値を生み出す技術の探求とその技術を基盤とした世界 初の新たな製品提案が必要となっている。

こうした状況下において、我々のグループでは、21世紀COE プログラムのもと、「構造・機能先進デザイン研究拠点の形 成」を目指し、今後5年間にわたって、次世代電子システム インテグレーション構築における(1)協調設計システムの構築 と(2)低温・高精度実装プロセスの確立を目指して、研究・開 発を行う予定である。

本稿では、本年度までに検討を行ってきた電気回路・熱協 調概略設計システムのコンセプトと樹脂材料を用いたセルフ アライメント実装について紹介する。

### 2. 電気回路・熱協調概略設計システムの構築

## 2-1 本研究の目的と背景

近年の電子機器の小型化、高機能化、製品サイクルの短縮 化に伴い設計に対する要求設計精度、設計期間の短縮等への 要求はますます厳しいものとなっている。トップダウン設計 は、ラフデザイン 基本設計 詳細設計と進むが、多様な設 計対象・観点が共存しているため、その相互影響が詳細設計 で露見するようになってきている<sup>1),2)</sup>。現在、電子回路基板の レイアウト概略設計は、総配線距離を最小な配置を元に、各 デバイスの TDP(Thermal design power) に対応する放熱構造を 実現している<sup>3)~8)</sup>。これらは基板での熱流の相互干渉が少な い対象では、効率よく熱設計と回路設計が切り分けられる。 しかし、相互干渉がある場合においては、設計者の経験や勘 が設計効率に大きく影響しているのが現状であるが、設計対 象の高速化・小型化による要求設計精度の上昇により各設計 の裕度が減少し、この方法では的確な設計の切り分けができ なくなってきている。これは回路設計側が設定する設計裕度 がないので、熱設計の可能領域と重ならないために起こる。 この矛盾を解消するには、本来両設計が設計可能となる領域 を出し合い、それらの設計可能領域の重なりを算出し、その 中で解を探すことにより設計する必要がある。従って、これ らの問題を解決し、熱・回路設計を協調して設計を行うには、 詳細設計より上流の基本設計において、相互影響を相互の設 計に伝達し、協調して決定する裕度配分設計手法が基板のレ イアウト設計のようなトップダウン設計時には必要である。

そこで、本研究では、基板のレイアウト概略設計において 熱・回路の両設計に共通する設計パラメータを最低限の相互 影響である境界条件として着目し、協調設計に必要なモデル 構造と個別設計手法及びそれを用いた協調設計手法およびそ の支援システムを検討した。

### 2-2 熱・回路設計協調概略レイアウト設計コンセプト

まず、協調設計を行う流れについて検討を行った。設計者 が初期にイメージした初期設計解と設計目標を与え、それを 個別の観点で解析を行い、設計者により問題点を抽出し、そ の設計修正を各設計の設計修正可能範囲を設計者に提示する 設計支援手法を用いて行う。これを全問題点で繰り返すこと により進めていくことを考える。その具体的なフローが図1 である。ここで重要な要素技術は、協調設計を行う上での設 計モデルと対応した高速個別概略解析技術、設計修正時にお ける設計修正可能領域作成技術の3つである。

# 2-3 熱・回路協調設計モデルの検討

本設計手法における協調設計統合モデルと協調設計メタモ デルについて図2に示す。協調設計統合モデルはトップダウ ン設計の協調設計を考慮して各製造技術に対応し、さらに各 設計観点での機能でモジュール化され、基板モジュールとデ バイスモジュール、配線モジュールの各モジュールに分割さ れ、それらの数・位置および接続関係から成る。また、協調 設計パラメータとして、熱設計、回路設計の共通パラメータ を組み込んだ。

# 2-4 モジュール型熱概略解析・設計支援手法 2-4-1 モジュール型熱概略解析・設計モデル

図3は、モジュール型熱概略解析手法の熱解析モデルであ る。この図に示すように、システム全体がモジュールに分割 され、各モジュール間に境界条件が設定している。これには 2つの理由がある。一つは、設計過程でのデバイスレイアウ ト変更によるモデル変更を簡略にするためである。もう一つ は、全体の熱解析において、熱流の相互影響を考慮しつつ各 モジュールにおける解析の独立性を維持できるようにするた めである。さらに、このサブモジュールへの分割には、製造



図2 熱・回路概略協調設計のためのモジュール化モデル

技術という観点から基板、半導体デバイス、パッケージ、ヒートシンク等に分割されている。

図に示すように、各デバイスからの熱流が相互に影響する 基板モジュールでは、基板材料、冷却条件、基板サイズとし てモデル化されており、基板モジュールの熱的な状態として は基板の温度分として表現される。

### 2-4-2 モジュール型熱概略解析手法

本手法は、一般的な有限要素法による熱解析とは違い各デ バイスモジュールと基板モジュールの境界条件が整合する条 件を算出することによって、シミュレーションを行うもので ある。この境界条件の決定手法は、基板への入熱量と、他の デバイスモジュールからの熱流による温度上昇の2つの境界 条件間での整合を取ることにより決定する。この時、各モ ジュールでの解析は、基板モジュールの解析は熱伝導方程式 の1次の線形性より、モジュール間境界条件である各デバイ



図4 デバイス温度のシミュレーション結果

スモジュールからの熱流が作る温度分布の重ね合わせで算出 できる。ここで、デバイスモジュールは2つの境界条件を前 提とした熱回路網法によって算出できる。

本概略熱解析法では、図4に示すように3%以下の解析誤差 でデバイス温度を解析できることを FEM との比較により検証 した。

#### 2-4-3 モジュール型熱概略設計支援

本解析手法を設計の観点から評価した時、デバイスモ ジュールの境界条件を変更しなければ、デバイスモジュール のあらゆる設計変更は他のデバイスモジュールの設計に影響 を与えない。また、本解析手法は、各デバイスモジュールが 基板モジュールに流す熱流が他のデバイスモジュールの境界 条件に与える影響を各々定量的に評価できる。さらに、ある デバイスモジュールが境界条件を変えた場合、本解析手法は 他のデバイスの境界条件の変化量も定量的に評価できる。ま た、個別のデバイスモジュールの設計は、従来の設計技術を 利用することが可能である。このことから、問題が解決する のに必要なデバイスモジュールの境界条件の変更量の決定を 支援できる。さらに、デバイスモジュールの境界条件の変更 による他のデバイスモジュールへの影響をなくす他のデバイ スモジュールの設計変更を定量的に決定できる。

これらの結果、モジュール間境界条件に着目することによ り、設計者が取り扱う設計パラメータを減らすことができ、 トップダウン設計で行う必要のある裕度分配設計ができる設 計コンセプト、及びその設計支援手法の構築が出来た。この



図5 概略回路設計モデル

場合、下記の4つの観点から設計修正案を作成し、設計者を 支援する。

- ・境界条件を変更しない設計修正
- ・境界条件の基板への熱流を変更する設計修正
- ・境界条件のモジュール位置を変更する設計修正
- ・熱相互影響場である基板設計を変更する設計修正
- 2-5 モジュール型回路概略解析
- 2-5-1 モジュール型回路概略解析モデル

図5は、モジュール化設計に対応した回路レイアウト設計 モデルである。本研究では、信号が伝送されるときの電磁界 の条件がほぼ同じ所は同種の伝送条件として取り扱い、線路 の減衰、遅延、特性インピーダンスの基本特性を、線路の構 造毎に事前に既存の手法で解析したデータを用いてデータ ベースを構築しておくことによって解析を行う。この結果、 伝送線路をモジュール分割し、パッケージング部、デバイス 直下の領域、パッケージ近傍領域、ビア、使用配線層毎の直 線配線領域等に分割する。

#### 2-5-2 モジュール型回路概略解析手法

モジュール分割線路モデルの信号解析コンセプトは、各モ ジュールの影響度を適切に評価できる機能を提供し、設計修 正時に設計者を支援することである。また、信号の減衰、反 射、遅延に対する配線サブモジュールの影響度を推定する機 能が必要である。また、減衰、反射、遅延の状態が周波数に より異なるので、矩形波を高調波成分に分解し、最後に各高 調波成分の結果を合成して波形を作成する必要がある。図6 に、各モジュールでの反射・減衰・遅延の特性を統合する手 法の概略図を示す。図6では、下方向を時間軸にとってあり、 配線サブモジュール内での信号速度で傾きが変わる。この手 法は一般的な矩形波の反射計算をモジュール化モデルにあわ せて改良したもので電圧を時間関数にし、減衰の影響を入れ たものである。これらを時間軸ごとにプロットすれば、受信 端到達時の高調波の変化がわかる。最終的には、各高調波成 分について同様の計算を行い、それらを加算し、時間軸に従 いプロットすれば線路通過後の信号波形が求まる。



図6 連結モジュールにおける信号伝播特性の統合化手法

2-6 まとめ

レイアウト概略設計において、モジュール型熱・回路設計 協調による設計手法について得られた結論について述べる。 (1) 熱・回路協調概略レイアウトのトップダウン設計におけ

- る協調設計用のモジュール化モデルの構築を行った。
- (2) 両設計でのモジュールへの裕度分配可能範囲に対応する 設計修正可能範囲を用いた協調設計フローを提案した。
- (3) モジュール間境界条件に着目したモジュール型熱概略解 析手法を従来 FEM に対しての誤差 3% 以下で構築した。
- (4) モジュール間境界条件に着目した線形化モデルによる、 設計修正量の定量評価による設計支援手法を構築した。
- (5) 伝送線路の電磁気学的状況によりモジュール化したモデ ルによる、モジュール型回路概略解析モデルを構築した。
- (6) モジュール毎の特性データベースにより、減衰、位相差、 反射を考慮した波形解析手法を構築した。
- 3. 樹脂材料による低温・高精度実装プロセスの開発
- 3.1 樹脂材料による低温・高精度実装プロセス

近年、高度情報化・マルチメディア化に向け、膨大な情報 を高速に伝送・処理するために光・電子融合システムが注目 されている。特に、これらの高密度微細実装や光デバイス・ 素子の実装においては、高精度な位置決め技術が要求されて いる。しかしなから、一般には、画像センシングと高精度な 移動ステージを用いて行われているが、サブミクロンオー ダーの位置決めには高価な装置と位置決め時間を要する。電 子デバイス実装の接続材料として用いられているソルダの表 面張力に基づくセルフアライメント機能を積極的に高精度位 置決めに適用しようとする試みが報告されている。しかし, ソルダを用いたセルフアライメントプロセスでは、ソルダの 融点以上に加熱する必要があり、さらに、一般にはフラック スを用いる必要がある。

本研究では、図7に示すように次世代光・電子融合システ ムの高精度セルフアライメント実装構造を想定し、今後の 光・電子融合実装や3次元実装への適用においては、低温、鉛 フリー、無フラックスでアライメント実装が可能な新たな材 料によるセルフアライメントプロセスの開発が必須である。 低温実装プロセスが可能で、フラックスレスや鉛フリー化が 可能な新たな接続材料として導電性接着剤による実装に関す る研究が進められている。しかし、樹脂材料の表面張力は、溶 融ソルダの1/10以下と小さく、セルフアライメント機能を発 現させるのが困難とされていおり、実用化に際して高い障壁 となっている<sup>9)</sup>。本研究では、セルフアライメント機能発現 が実装材料表面との接触角に起因する位置決め境界の存在と いう点に着目し、濡れ性が大きく異なる境界をパッドを立体 的に形成することにより位置決め境界を作り出すことに成功 した。この基本考え方を用い、表面張力の小さい樹脂材料の アライメント機能を発現させるために作られた立体パッドを 用い、液状樹脂によるセルフアライメントプロセスとして、 図8に示すプロセスを研究・開発した<sup>10)-12)</sup>。一つ目は、一般



図7 次世代光・電子融合システムの高精度セルフアライメ ント実装構造の概略図.



図8 樹脂材料の表面張力を用いた新たなセルフアライメン トプロセス.

の溶融はんだによるセルフアライメント実装と同様に、位置 決め対象の部品を上方から供給された液状樹脂に接触搭載す るプットダウン方式である。二つ目は、部品上に液状樹脂を 供給し、基板を上方から液滴に接触させた後、上方に吊り上 げるプルアップ方式である。このプロセスの特徴はチップ部 品と基板の位置を変え、チップ部品を基板の下方から実装す ることにより液滴にかかるチップの重量を液滴形状が凹形に なることにより吸収し、液状樹脂がパッドの側面にぬれ広が ることを無くし、より簡易なプロセス制御で樹脂材料による セルフアライメント機能を発現させることができる。

# 3.2 数値シミュレーション

より安定なアライメントプロセスを構築するために、図9 に示す液滴バンプ形状モデルを提案し、図10に示す数値シ ミュレーション手法を構築した。静的釣合い下において、液 滴の表面形状はラプラス式で示される。

$$\Delta P = P_0 - P_a = \gamma \ (\frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2})$$
(1)





図10 数値シミュレーションのアルゴリズム.

ここで、*P*<sub>0</sub>、*P*<sub>a</sub>、 は液滴の内部圧力、外部圧力、表面張力を 表す。*R*<sub>1</sub>と*R*<sub>2</sub>はチップ高さ*h*<sub>5</sub>での液滴表面の主曲率半径で液 滴内側にある場合を正にとる。両プロセスの静的釣り合いの 液滴最上部での垂直方向の力の釣り合いは、

$$(put \ down) \gamma_{l} \cos \beta_{s} \cdot 2\pi r + mg = \Delta P \cdot \pi r^{2}$$

$$(pull \ up) \quad \gamma_{l} \cos \beta_{s} \cdot 2\pi r - mg = \Delta P \cdot \pi r^{2}$$

$$(2)$$

の関係が成立する。主曲率半径R2は液滴の幾何学的形状から 求められ、*R*,は式(1)の関係式から求められる。

$$R_2 = \frac{r}{\cos\beta_s} , \quad R_1 = \frac{\gamma \cdot R_2}{\Delta P \cdot R_2 - \gamma}$$
(3)

また、液滴の体積 Vs は

$$V_s = 2 \cdot \pi \int_0^{R \sin \beta_s} x^2 dy \tag{4}$$

と求められる。液滴形状を決定するパラメータとして、液滴体積*Vs*、表面張力 と液滴内・外部の圧力差 *P*が挙げられ、 圧力差はチップの重量*W*、パットの半径*r*と表面張力 との 関数であり、液滴形状を決められるパラメータであると言え る。

数値シミュレーション手法としては、最初に初期供給する 液滴の体積 $V_0$ とチップの重量Wとパット半径rを決め、液滴 とパットとの接触角 。を任意に仮定する。この触角を用いて 静的釣り合い状態の垂直方向の力の平衡方程式と液滴内・外 部の圧力差と式(3)を用いて主曲率半径を求める。そして、 初期供給した体積 $V_0$ と数値計算で得られた体積Vsとを比較 し、一致するまで数値計算を繰り返すことで液滴形状を決め るパラメータ( $R_1R_2h_s$ )を求めている。さらに、本研究 で構築した数値シミュレーションの妥当性を表面エネルギー に基づくSurface Evolver<sup>13</sup>によるシミュレーションと合わせて 検証を行った結果、Evolverの結果との対応がよく取られてお り、より簡単に、 効率的にプロセスパラメータの設計が可能 であることを立証した。

## 3.3 セルフアライメント挙動および精度

セルフアライメント実装が可能である重さの部品を搭載し てアライメントを行い、そのアライメントされた状態から強 制的にズレを与えて、再度アライメントさせた時の時間によ る実際のチップの挙動を高速カメラを用い、パッドの側面を 撮像した写真を図11に示す。ここではプルアップ方式のアラ イメント挙動で、材料は粘度が低いエポキシ樹脂を用い、位 置ずれを100 µmとし、搭載部品の重量は64 × 10<sup>-5</sup>N とした。 これらの結果を見ると所定の位置ズレから時間とともにサー プミクロンオーダの高い精度でアライメントされていること が分かる。

これは、プットダウン方式でも同じく短時間で高い精度で アライメントされている。さらに、位置決め対象と基板の位 置を変えることで液滴の下部にチップの重量が掛かるため、 液滴バンプの形状が凹形になっており、表面張力が小さい材





(a) t : 0 s, b<sub>0</sub> : 100 μ m





(c) *t* : 1 s, *b*<sub>0</sub> : 7 μ m

(d) t : 3 s, b<sub>0</sub> : 0.1 μ m

図11 エポキシ樹脂を用いたアライメント挙動.



図 12 プルアップ方式でのセルフアライメント挙動および 精度.

料においても立体的に形成されたパッドの外側に濡れ広がる 可能性が低くなっている。また、粘度が相対的に高いフェノ キシ樹脂とエポキシ樹脂を用いた時のアライメント挙動と精 度の比較を図11に示す。実験は各5回ずつ行い、データを最 小二乗フィッチングして示した。結果から見られるようにア ライメント挙動は一般の溶融ソルダの流体的な減衰振動 (underdamped osillation)挙動と大きく異なり、過減衰 (overdamped)挙動をすることが分かる。エポキシ樹脂では与 えられたズレ10µmに対して、約3秒以内でアライメントさ れているがフェノキシ樹脂を用いた場合は約25秒と大きな時 間差か見える。この原因としては樹脂の粘度が一般の溶融は んだの粘度より非常に大きく(数万倍一数十万倍)、アライメ ントされる際に樹脂の粘度により生じる内部摩擦力である減 衰力(damping force)が大きくなるからである。したがって、液 滴樹脂材料の表面張力を用いたアライメントプロセスではセ ルフアライメント機能を発揮させるには表面張力だけではな く粘度も考慮する必要がある。

特に、一旦チップを動かす粘度範囲以内での樹脂材料であ れば粘度がアライメント精度には緊密な影響は見られなかっ たが、プットダウン方式とプルアップ方式、いずれの方式に おいても平均アライメント精度が0.4µm以下で安定にアライ メントが行われており、樹脂材料によるサブミクロンオー ダーの安定なセルフアライメント実装の可能であった。さら に、レーザ変位センサーの振れ範囲が±0.1µmであるのでア ライメント精度はセンサーのバラツキ範囲であると言え、こ の精度以上は纏められていないが、実際の精度はより高いと 言える。これらの 実験結果から分かるように、表面張力が 小さい材料を用いても樹脂材料によるサブミクロンオーダー の安定なセルフアライメント実装の可能性が示唆された。

- 5.参考文献
- P.A.SANDBORN, et al, "Analyzing Packaging Trade-Offs Dur ing System Design", IEEE Design & Test of Computers, p.10-19, 1998
- 2) S.Jain, et al, "PCB Layout Design Using a Genetic Algorithm", ASME Design Engineering Technical Conferences, DE-Vol.82, pp.529-536, 1995.
- 3) 坂主他, BSG 構造に基づく配置・概略配線同時最適化手法の 提案, 電子情報通信学会技法CAS97-40, VLD97-40, DSP97-55,

(1997), pp.175-182

- 4)高玉他,組織学習エージェントによるプリント配線版設計 問題への接近,電子情報通信学会論文集 D-IVoI, J81-D-I No.5, (1998), pp.514-522
- 5)久保田他、線分展開法を拡張した多層グリッドレス配線手 法、電子情報通信学会論文集 A Vol, J76-A No.3(1993), pp.410-420
- 6)川口他、配線可能性検証のための容量判定グラフとフロー 導出グラフ、電子情報通信学会論文集 A Vol, J80-A No.1 (1997), pp.135-142
- 7) Isao Kaneda, et al, "Characteristic Impedance Control of Maltilayer PWB in Dual Strip Line Structure", ICEP Proceedings, pp.546-550, 2002
- Y.j.Hang, et al, "Thermal Placement Design for MCM Applica tion", Trans. ASME Journal of Electronic Packaging, Vol.122, No.2, pp.115-120,2000.
- P. G. Harris, Soldering & Surface Mount Technology, 20 (1995)
   19.
- K. Fujimoto, M. M. Kim, S. Nakata, IEICE Transaction on Elec tronics, 12 (2001) 1967.
- J. M. Kim, K. Yasuda, K. Fujimoto, S. Nakata, Quarterly Journal of the JWS, 3 (2001) 346.
- 12) J. M. Kim, K. Yasuda, Y. E. Shin, K. Fujimoto, IEICE Transact -ion on Electronics, 7 (2002) 1491.
- 13) K. A. Brakke, Surface Evolver Manual, (1998)